

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004 年 10 月 7 日 (07.10.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/086565 A1

(51) 国際特許分類⁷: **H01R 11/01**, H01B 5/00,
5/16, 1/22, H01L 21/66, G01R 1/06

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/003931

(22) 国際出願日: 2004 年 3 月 23 日 (23.03.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-085092 2003 年 3 月 26 日 (26.03.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): JSR
株式会社 (JSR CORPORATION) [JP/JP]; 〒1040045 東
京都中央区築地五丁目 6 番 1 0 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 五十嵐 久夫
(IGARASHI, Hisao) [JP/JP]; 〒1040045 東京都中央区

築地五丁目 6 番 1 0 号 JSR 株式会社内 Tokyo (JP).
佐藤 克己 (SATO, Katsumi) [JP/JP]; 〒1040045 東
京都中央区築地五丁目 6 番 1 0 号 JSR 株式会
社内 Tokyo (JP). 井上 和夫 (INOUE, Kazuo) [JP/JP]; 〒
1040045 東京都中央区築地五丁目 6 番 1 0 号 JSR
株式会社内 Tokyo (JP).

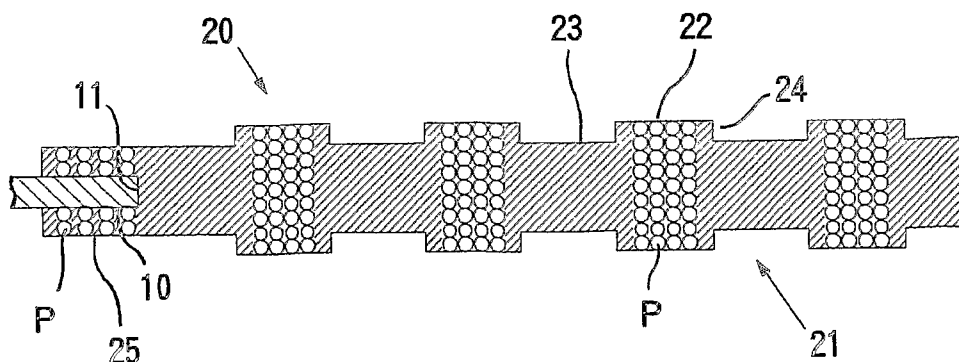
(74) 代理人: 大井 正彦 (OHI, Masahiko); 〒1010052 東京都
千代田区神田小川町三丁目 6 番地 1 栄信ビル Tokyo
(JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: ANISOTROPIC CONDUCTIVE CONNECTOR, CONDUCTIVE PASTE COMPOSITION, PROBE MEMBER,
WAFER INSPECTION DEVICE AND WAFER INSPECTION METHOD

(54) 発明の名称: 異方導電性コネクタおよび導電性ペースト組成物、プローブ部材並びにウエハ検査装置および
ウエハ検査方法



(57) Abstract: An anisotropic conductive connector is disclosed which can maintain good conductive properties for a long time in a case where the connector is repeatedly used many times in electrical inspections of integrated circuits formed on a wafer. The anisotropic conductive connector has a high durability and a long life. Applications of such an anisotropic conductive connector are also disclosed. The anisotropic conductive connector comprising an elastic anisotropic conductive film that is provided with a plurality of conductive parts for connection which contain conductive particles and extend in the thickness direction is characterized in that each conductive particle contained in the conductive parts for connection is formed by covering the surface of a magnetic core particle with a coating layer composed of a highly conductive metal, and in that the coating layer has a high hardness.

(57) 要約: ウエハに形成された複数の集積回路の電気的検査において、多数回にわたって繰り返して使用された場合に、長期間にわたって良好な導電性が維持され、従って、耐久性が高く長い使用寿命が得られる異方導電性コネクタおよびその応用が開示されている。本発明の異方導電性コネクタは、導電性粒子が含有された厚み方向に伸びる複数の接続用導電部が形成された弾性異方導電膜を有する異方導電性コネクタにおいて、前記接続用導電部に含有された導電性粒子は、磁性を示す芯粒子の表面に高導電性金属よりなる被覆層が積層されてなり、当該被覆層は高硬度な被覆層であることを特徴とする。



WO 2004/086565 A1



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

— 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。